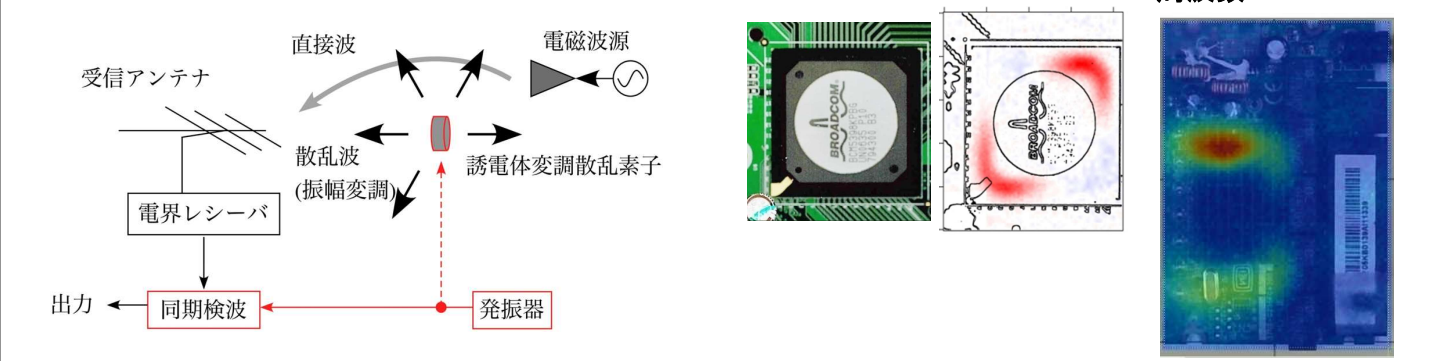


シーズの名称	<h2 style="margin: 0;">電磁界計測システム</h2> <h3 style="margin: 0;">～低侵襲高周波センシング技術の開発～</h3>
--------	--

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">権利等の種類</td> <td style="padding: 2px;">特許</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">権利状態</td> <td style="padding: 2px;">県単独所有</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">実施許諾実績</td> <td style="padding: 2px;">なし</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">現状(段階)</td> <td style="padding: 2px;">実用化</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">特許権の譲渡</td> <td style="padding: 2px;">不可</td> </tr> </table>	権利等の種類	特許	権利状態	県単独所有	実施許諾実績	なし	現状(段階)	実用化	特許権の譲渡	不可		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">環境浄化</td> <td style="width: 25%;">医療用</td> <td style="width: 25%;">機械・器具</td> <td style="width: 25%;">IT</td> </tr> <tr> <td>工具</td> <td>材料</td> <td>検査装置</td> <td>表面処理</td> </tr> <tr> <td>液晶</td> <td>半導体</td> <td>自動車</td> <td>光学機器</td> </tr> <tr> <td>金型</td> <td>電子部品</td> <td>計測装置</td> <td>通信機器</td> </tr> <tr> <td>センサ</td> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	環境浄化	医療用	機械・器具	IT	工具	材料	検査装置	表面処理	液晶	半導体	自動車	光学機器	金型	電子部品	計測装置	通信機器	センサ	その他			
権利等の種類	特許																																
権利状態	県単独所有																																
実施許諾実績	なし																																
現状(段階)	実用化																																
特許権の譲渡	不可																																
環境浄化	医療用	機械・器具	IT																														
工具	材料	検査装置	表面処理																														
液晶	半導体	自動車	光学機器																														
金型	電子部品	計測装置	通信機器																														
センサ	その他																																

概要図	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 誘電体散乱を利用した計測手法により低侵襲性を実現 </div> 
-----	---

特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・マイクロ波～ミリ波帯の電界分布計測 ・非金属センサ, ワイヤレス測定→電磁界を乱さない ・1mm以下の空間分解能
----	---

独自性	<ul style="list-style-type: none"> ○誘電体散乱を利用した計測手法により低侵襲性を実現 ○光変調方式の採用により高空間分解能を達成
-----	--

サポート	実用化に向けた技術支援
------	-------------

特許・論文等	<ul style="list-style-type: none"> ・電磁界計測システム(特許 第4915565号) ・“光学的変調散乱素子を用いた高周波電界計測システム”, 黒澤孝裕, 駒木根隆士, 電子情報通信学会論文誌, vol.J97-B, no.3, pp.279-285 (2014).
--------	--

キーワード	高周波計測、電界分布、マイクロ波、ミリ波、EMC
-------	--------------------------

関連記事等	<ul style="list-style-type: none"> ・不要な電磁波、迅速測定(秋田魁新報 H29.11.22) ・光変調散乱素子を用いた完全非金属製高周波電界センサとそのEMC計測への応用(月刊EMC H30.10月号)
-------	---

お問い合わせ先	秋田県産業技術センター 技術イノベーション部 TEL: 018-862-3414 Email: soudanshitu@rdc.pref.akita.jp
---------	--